

สารบัญ

	หน้า
คำขอบคุณ	ก
บทคัดย่อ	ง
Abstract	ฉ
รายการตารางประกอบ	ญ
รายการภาพประกอบ	ฉ
บทที่ 1 บทนำ	1
บทที่ 2 ทฤษฎี	4
2.1 โครงสร้างของสารประกอบสังกะสีซัลไฟต์	4
2.2 การนำไฟฟ้าผ่านฟิล์มฉนวน	6
2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่า dielectric constant กับความถี่	15
2.4 วงจร RC	18
2.5 การสะท้อนและการทะลุผ่านของแสงในฟิล์มชั้นเดียว	21
บทที่ 3 วิธีอุปกรณ์และวิธีการทดลอง	24
3.1 สารเคมีที่ใช้เตรียมฟิล์มและทำความสะอาดแผ่นรองรับ	24
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	24
3.3 อุปกรณ์ในการเตรียมฟิล์ม	26
3.4 การทำความสะอาดแผ่นรองรับ	27
3.5 การเตรียมฟิล์ม	28
3.6 การวัดความหนาของฟิล์ม	31
3.7 การศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าของฟิล์ม	33
3.8 การศึกษาสมบัติทางแสงของฟิล์ม	39
บทที่ 4 ผลการทดลอง	41

	หน้า
4.1 รายละเอียดของฟิล์ม	41
4.2 ผลการวัดกระแสและความต้านทานรวมฟิล์ม	44
4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและความต้านทาน	46
4.4 ผลการวัดค่า RC time constant	52
4.5 ผลการวัดกระแสบนฟิล์มและกระแสบนตัวเก็บประจุ อ้างอิง ณ ความถี่ต่าง ๆ	54
4.6 ผลการวัดการทะลุผ่านของแสง	59
4.7 วิเคราะห์ผลการทดลอง	60
บทที่ 5 สรุปผลการทดลองปัญหาและข้อเสนอนะ	77
5.1 สรุปผลการเตรียมฟิล์มสังกะสีซัลไฟด์	77
5.2 สรุปผลการวัดกระแสและความต้านทานรวมฟิล์ม	78
5.3 สรุปผลการวัดความจุของฟิล์มและการวัดค่า dielectric constant ของสังกะสีซัลไฟด์	79
5.4 สรุปผลการทะลุผ่านฟิล์มของแสง	80
5.5 ปัญหาและข้อเสนอนะ	80
ภาคผนวก	84
ผนวก ก การหาความหนาของฟิล์มโดยอาศัยการเปลี่ยนความถี่ของ ผลึกควอตซ์	85
ผนวก ข ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มแสงกับกระแสโฟโตโวลตาอิก	88
ผนวก ค การเปลี่ยนความถี่ของผลึกควอตซ์ตามความดัน ที่อุณหภูมิ 28 °C	89
ผนวก ง การเปลี่ยนแปลงความถี่ของผลึกควอตซ์ตามอุณหภูมิ ที่ความดัน บรรยากาศ	90
ผนวก จ คุณสมบัติของ Mica dielectric condenser	91
ผนวก ฉ คุณสมบัติของ semi conductor บางชนิด	92
บรรณานุกรม	93
ประวัติการศึกษา	95

รายการตารางประกอบ

ตารางที่	หน้า
4.1 แสดงช่วงความถี่ที่เปลี่ยนไปและความหนาของฟิล์มชุด A	41
4.2 แสดงความถี่ที่เปลี่ยนไปและความหนาของฟิล์มชุด B	42
4.3 แสดงความถี่ที่เปลี่ยนไปและความหนาของฟิล์มชุด C	42
4.4 แสดงความถี่ที่เปลี่ยนไปและความหนาของฟิล์มชุด D	43
4.5 แสดงความถี่ที่เปลี่ยนไปและความหนาของฟิล์มชุด E	43
4.6 แสดงกระแสผ่านฟิล์ม และความต้านทานรวมของฟิล์มชุด A	44
4.7 แสดงกระแสและความต้านทานรวมของฟิล์มชุด B	45
4.8 แสดงความต้านทานของฟิล์มชุด D	46
4.9 แสดงความต้านทานของฟิล์มชุด E	46
4.10 แสดงค่า time constant ของฟิล์มชุด A	52
4.11 แสดงค่า time constant ของฟิล์มชุด B	53
4.12 แสดงค่า time constant ของฟิล์มชุด C	54
4.13 แสดงกระแสผ่านตัวเก็บประจุอ้างอิงและกระแสผ่านฟิล์ม C ₇ ที่ความถี่ 100 Hz - 1 MHz	55-56
4.14 แสดงกระแสผ่านตัวเก็บประจุอ้างอิงและกระแสผ่านฟิล์ม C ₈ ที่ความถี่ 100 Hz - 1 MHz	57-58
4.15 แสดงกระแสโฟโตไดโอดเมื่อให้แสงผ่านฟิล์มไปตกกระทบบน	59
4.16 แสดงความต้านทานที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากการนำ กระแสแบบ ohmic เป็นแบบ SCL	60
4.17 แสดงค่าความจุของฟิล์มชุด A และค่า dielectric constant ของฟิล์มสังกะสีซัลไฟด์	62
4.18 แสดงค่าความจุของฟิล์มชุด B และค่า dielectric constant ของสังกะสีซัลไฟด์	63

ตารางที่	หน้า
4.19 แสดงค่าความจุของฟิล์มชุด C และค่า dielectric constant ของสังกะสีซัลไฟต์	64
4.20 แสดงความจุของฟิล์ม C ₇ และค่า dielectric constant ณ ความถี่ต่าง ๆ	68
4.21 แสดงความจุของฟิล์ม C ₈ และค่า dielectric constant ณ ความถี่ต่าง ๆ	69
4.22 แสดงเปอร์เซ็นต์การทะลุผ่านของแสงของฟิล์มชุด A,B และ C	73
5.1 แสดงสมบัติทั่วไปของฟิล์ม	77
5.2 แสดง break down voltage ของฟิล์ม	79
5.3 แสดงความจุและค่า ϵ_r ที่หาได้จากฟิล์ม A, B และ C	80

รายการภาพประกอบ

รูปที่	หน้า
2.1 แสดงโครงสร้างของ Zinc blende	4
2.2 แสดงโครงสร้าง Wurtzite ของ ZnS	5
2.3 แสดงลักษณะผิวสัมผัสที่ทำให้เกิด ohmic contact	7
2.4 แสดงลักษณะของรอยต่อที่จะทำให้เกิด Neutral contact	7
2.5 แสดงลักษณะผิวสัมผัสที่จะทำให้เกิด blocking contact	8
2.6 แสดง Cathode region และ anode region ภายใต SCL conduction	9
2.7 แสดง diagram พลังงานของ shallow traps ในฉนวน	12
2.8 แสดง SCL I-V characteristic สำหรับฉนวนที่มี shallow traps	14
2.9 แสดงการเปลี่ยนแปลง ϵ' และ ϵ'' ตามความถี่ ω	17
2.10 แสดงวงจร RC	18
2.11 แสดงความต้านทานรวมที่แปรผันกับอุณหภูมิ	20
2.12 แสดงการสะท้อนและการทะลุผ่านฟิล์มชั้นเดียว	21
2.13 แสดงการสะท้อนจากฟิล์มชั้นเดียวเมื่อ n_1 มีค่าต่าง ๆ	23
3.1 แสดงระบบในสุญญากาศ	25
3.2 แสดงหน้าฉากที่ใช้เตรียมฟิล์มสังกะสีสัลดไฟต์และขั้วไฟฟ้า	27
3.3 แสดงชุดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเตรียมฟิล์มในระบบสุญญากาศ	28
3.4 แสดงลักษณะของขั้วไฟฟ้าหลังจากเตรียมเสร็จ ขั้นที่ 1	29
3.5 แสดงลักษณะของฟิล์มหลังจากเตรียมเสร็จ ขั้นที่ 2	30
3.6 แสดงฟิล์มสังกะสีสัลดไฟต์พร้อมขั้วไฟฟ้า	30
3.7 แสดง boat molybdenum และ heater หึงสะเทินที่โร้ระเหยสาร	31

รูปที่	หน้า
3.8 แสดงการติดตั้งระบบตรวจวัดความหนาของฟิล์ม	32
3.9 แสดงวงจรออสซิลเลเตอร์เพื่อป้อนสัญญาณให้กับเครื่องนับความถี่	33
3.10 แสดงวงจรที่ใช้ศึกษา I-V characteristic ของฟิล์ม	34
3.11 แสดงชุดอุปกรณ์ที่ใช้วัด I-V characteristic ของฟิล์ม	35
3.12 แสดงวงจรที่ใช้วัดค่า RC time constant เพื่อหาความจุของฟิล์ม	36
3.13 แสดงสัญญาณที่ปรากฏบนจอของ oscilloscope ในขณะที่วัด RC time constant	37
3.14 แสดงชุดอุปกรณ์ที่ใช้วัด RC time constant ของตัวต้านทานและฟิล์ม	37
3.15 แสดงวงจรวัดกระแสผ่าน C_s และ C_f	39
3.16 แสดงอุปกรณ์ที่ใช้วัดการทะลุผ่านของแสงของฟิล์มสังกะสีซัลไฟด์	40
4.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและความต่างศักย์ของฟิล์ม A_4, A_5, A_7 และ A_8	47
4.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและความต่างศักย์ของฟิล์ม A_1, A_2, A_3 และ A_4	48
4.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและความต่างศักย์ของฟิล์ม A_5, A_6, A_7 และ A_8	49
4.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกระแสและความต่างศักย์ของฟิล์ม B_1 และ B_3	50
4.5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง I กับ V^2 ของฟิล์ม A_4, A_5, A_7 และ A_8	51
4.6 แสดงค่า dielectric constant ตามความหนาของฟิล์ม	65
4.7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่า dielectric constant ของสังกะสีซัลไฟด์กับความถี่	72
4.8 แสดงเปอร์เซ็นต์การทะลุผ่านฟิล์มของแสงตามความหนา	75